



Рис. 4. Рентгенограммы, полученные от структуры Ni – V/Pt/Si с толщиной слоя сплава Ni – V 40 нм до БТО и после БТО при различных температурах

Fig. 4. X-ray diffraction patterns obtained from the Ni – V/Pt/Si structure with a Ni – V alloy layer thickness of 40 nm before rapid heat treatment and after rapid heat treatment at different temperatures